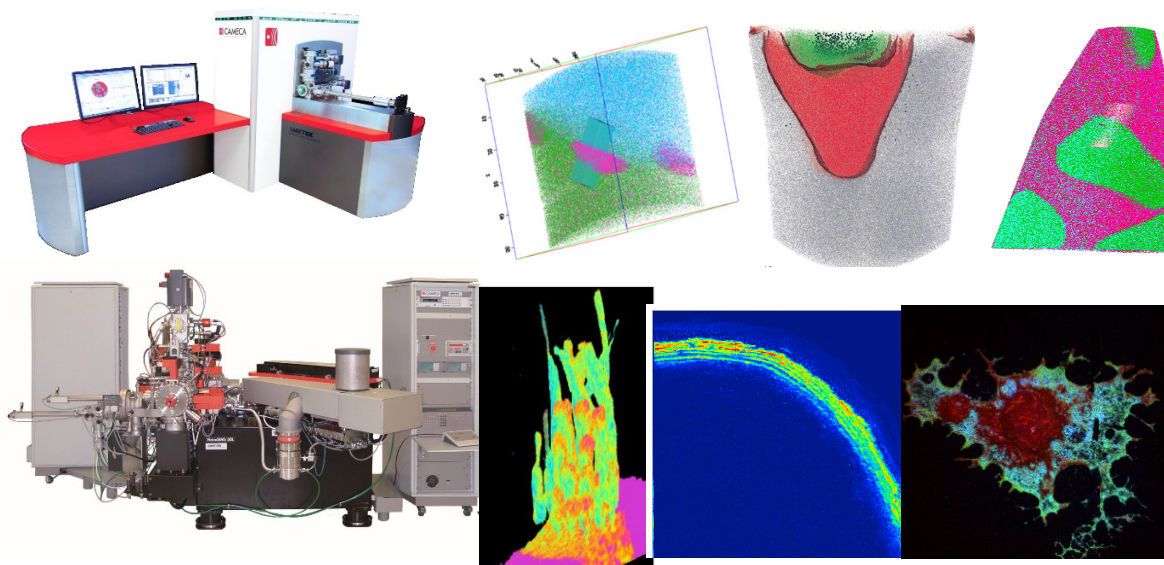


## Семинар

# Атомно-зондовая томография и масс-спектрометрия вторичных ионов в исследовании наноразмерных систем

19 мая 2016 г.



### Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в семинаре “Атомно-зондовая томография и масс-спектрометрия вторичных ионов в исследовании наноразмерных систем”. Семинар ставит перед собой задачу ознакомить слушателей с последними достижениями в области элементного и изотопного нано- и микроанализа.

Семинар ориентирован на ученых и преподавателей, работающих в области Физики, Химии, Материаловедения, Геологии и Биологии.

### Организатор мероприятия:

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН  
г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 159

### Регистрация

Просим подтвердить Ваше участие в семинаре  
до 13 мая 2016 по электронной почте

[igor.fedik@ametek.com](mailto:igor.fedik@ametek.com)





## Программа семинара

<b>9.00 – 10.00</b>	<i>Регистрация</i>
<b>10.00-10.10</b>	<i>Открытие семинара</i>
<b>10:10-10:50</b>	Обзор линейки CAMECA
<b>10:55-11:40</b>	Введение в метод атомно-зондовой томографии. Технология
<b>11:40-12:00</b>	<i>Кофе-пауза</i>
<b>12:00-13:30</b>	Приложения метода атомно-зондовой томографии: от материаловедения до геологии и биологии
<b>13.30-14.30</b>	<i>Фуршет</i>
<b>14:30-15:15</b>	Масс-спектрометр вторичных ионов NanoSIMS. Технология
<b>15:15-16:45</b>	Приложения NanoSIMS: суб-микронный элементный и изотопный анализ высокой чувствительности в задачах материаловедения, гео- и космохимии и биологии
<b>16:45-17:00</b>	<i>Кофе-пауза</i>
<b>16:00-17:30</b>	Обсуждение

### Приглашенные докладчики:

Секция атомно-зондовой томографии:  
Peter Clifton – **CAMECA USA**

Секция масс-спектрометрии вторичных ионов:  
Philippe Saliot – **CAMECA FRANCE**

### Информационная поддержка:

#### ОПТЭК

105005, Россия, г. Москва, Денисовский пер., 26

тел.: (495) 933 51 51

e-mail: office@optecgroup.com

Представитель ОПТЭК в Дальневосточном регионе

Тел. +7 (914) 706 34 70

e-mail: office-vld@optecgroup.com